



概述

FA系列探针台是专为失效分析实验室设计的一款量测设备,具光学特性、激光特性,设备结构稳定,系统性能优异,人体工程学设计,操作便捷,支持多功能升级,产品功能丰富齐全。

应用方向

常温和高低温环境下的芯片失效分析、射频特性器件失效分析、材料/器件的IV/CV特性测试及失效分析、芯片内部线路/电极/PAD测试、IC/面板内部线路修改/去层

产品特点

- 大手柄驱动,无间隙移动
- 人体工程学设计,操作便捷舒适
- 多波段激光应用,快速切换精准切割
- 兼容高倍率金相显微镜,可微调移动
- 无回程差设计,定位精准
- 空气冷却结构体积小巧,无需维护
- 高精度系统,激光加工精度可达1*1um
- 领先的内部防震系统装置,运行更稳定

规格参数

型号		FA8	FA8-SC		
外形(长*宽*高) (mm)		960*850*1500	880*860*1550		
重量(kg)		约260	约280		
电力需求		220VC,50~60Hz			
样品台	尺寸	8英寸,可360度旋转			
	行程	X-Y行程8*8英寸			
	移动精度	1um			
	样品固定方式	真空吸附	真空吸附		
	温控范围	—	- 80~200℃		
	快速拉出	—	有		
	特殊运用	电学独立悬空,可作为背电极使用			
针座平台	规格	U型平台,最多可放置10个针座	O型平台,最多可放置12个针座		
	行程&调节方式	平台可以快速升降,行程 6mm并带自动锁定功能;			
光学特性	显微镜行程	X-Y轴行程2英寸*2英寸,Z轴:50.8mm	X-Y轴行程1英寸*1英寸,Z轴:50.8mm		
	放大倍数	20~4000X			
	镜头切换时操作	快速倾仰/气动升降			
	CCD像素	50W (模拟) /200W (数字) /500W (数字)	50W (模拟) /200W (数字) /500W (数字)		
激光特性	波段	波长可选择1064/532/355/266nm波段			
	功率	输出功率2.2mJ/pulse (可升级)			
	微加工能力	可加工材质:Cr/Al/ITO/Ni/TFT/RGB/Poly Silicon/Mo/SiN/CF内杂质等			
	精度	最小可加工精度1*1um (配置100X镜头时)			
	冷却方式	可选择风冷激光或水冷激光			
点针规格	X-Y-Z行程	12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8m			
	机械精度	2微米/0.7微米/0.1微米			
	漏电精度	10pA/100fA (配置屏蔽箱时)			
	接口形式	香蕉头/鳄鱼夹/同轴/参轴接口			
可选附件		卡盘快速拉出装置	液晶热点侦测套装	卡盘快速拉出装置	液晶热点侦测套装
		高压/大电流测试套装	加热台	高压/大电流测试套装	—
		屏蔽箱	转接头	屏蔽箱	转接头
		防震台	镀金卡盘	防震台	镀金卡盘
		同轴叁轴卡盘	光强/波长测试选件	同轴叁轴卡盘	光强/波长测试选件
		样品台快速升降,微调升降装置选件		—	
		射频测试附件	有源探头	射频测试附件	有源探头
		低电流/电容测试	光纤夹具耦合测试选件	低电流/电容测试	光纤夹具耦合测试选件
		封装器件夹具	PCB/封装夹具测试选件	封装器件夹具	PCB/封装夹具测试选件
		特殊定制		特殊定制	